# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.



TECHNOLOGY CENTER 20

(2-2-4) Prior art document 1 (Jpn. Pat. Appln. KOKAI Publication No. 2-229476) discloses the following: (Disclosure 1) Claims 1 and 2 disclose "a buffer layer formed of aluminium nitride (AlN) and provided on a sapphire substrate, said buffer layer being grown at a temperature from 400 to 900℃ until it has a thickness in the range of 100 to 500Å, and having a wurtzite structure wherein an amorphous crystal contains microcrystal particles and polycrystalline particles in a mixed state. (Disclosure 2) The upper right column on page 4 of the publication reads "the N layer 52 is in the pit-generated state when the buffer layer 51 is not thicker than 100Å. The N layer 52 is in the same state when the buffer layer 51 is not thinner than 500Å. To obtain an N layer with improved crystallinity, therefore, the thickness of the AlN buffer layer 51 is preferably within the range of 100 to 500Å.

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-229476

®Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)9月12日

H 01 L 33/00 21/205 21/86 A 7733-5F 7739-5F

7739-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全9頁)

◎発明の名称 窒化ガリウム系化合物半導体の気相成長方法及び発光素子

②特 願 平1-50458

②出 願 平1(1989)3月1日

⑩発 明 者 真 部 勝 英 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑 1 番地 豊田合成 株式会社内

⑩発 明 者 加 藤 久 喜 愛知県西春日井郡春日村大字落合字長畑1番地 豊田合成株式会社内

愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内 個発 鉙 者 赤 詥 勇 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内 平 政 明 者 松 和 個発

の発明者 天 野 浩 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし) 名古屋大学内

⑪出 願 人 豊田合成株式会社 愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑1番地

⑩出 願 人 名 古 屋 大 学 長 愛知県名古屋市千種区不老町(番地なし)

②出 顋 人 新技術開発事業団 東京都千代田区永田町2丁目5番2号

四代 理 人 弁理士 藤 谷 修

明知 善

1. 発明の名称

窒化がりウム系化合物半導体の気相成長方法及び発光素子

2. 特許請求の範囲

(1)有機金属化合物ガスを用いてサファイナ 延板上に窒化ガリウム系化合物半導体醇膜(A & g G a 1-1 N: X=0 を含む)を気相成長させる方法において、

サファイア基板上に、成長温度400 ~900 セで 阪厚100 ~500 人に成長され、結晶構造を無定形 結晶中に数結晶又は多結晶又の提在したウルツァ イト構造とする窒化アルミニウム(A&N) から成る バッファ層を設け、

前記パッファ層上に窒化がリウム系化合物半導体(All Gai-N; I=Oを含む)を成長させることを特徴とする窒化がリウム系化合物半導体の気相成長方法。

(2) サファイア基板と、発光層としての窒化 ガリウム系化合物半導体ppp (All Gail N; X=O を含む)を有する殆光集子において、

前記サファイア基板上に、成長温度400~900 でで膜厚100~500 人に成長され、結晶構造を無 定形結晶中に微結晶又は多結晶又の混在したウル ツァイト構造とする窒化アルミニウム(A&N) か ら成るパッファ層を設け、

前記パッファ層上に選化がリウム系化合物半導体(A & x G a 1-x N; X=0 を含む)を成長させることを特徴とする発光素子。

3.発明の詳細な段明

【産業上の利用分野】

本発明は窒化がりウム系化合物半導体の製法及び発光素子の構造に関する。 、

【従来技術】

従来、有機金属化合物気相成長法(以下「MOVPE」と記す)を用いて、窒化ガリウム系化合物半導体(Aℓx Ga; x N; X=0 を含む)薄原をサファイア基板上に気相成長させることや、その窒化ガリウム系化合物半導体薄膜を発光層とする発光素子が研究されている。

室化ガリウム系化合物半導体の単結晶ウェハーが容易に得られないことから、室化ガリウム系化合物半導体をそれと格子定数の近いサファイア基板上にェピタキシャル成長させることが行われている。

### 【発明が解決しようとする課題】

ところが、サファイアと発光層としての窒化がリウム系化合物半導体との格子不整合や、がリウムと窒素の蒸気圧が大きく異なるため、良質な窒化がリウム系化合物半導体結晶が得られないとう問題があり、このため、青色発光の発光効率の高い発光素子が得られなかった。

したがって、本発明は、上記の課題を解決するために成されたものであり、その目的とするところは、サファイア基板上に成長させる窒化がリウム系化合物半導体の結晶性を向上させると共に発光効率の高い青色の発光素子を提供することである。

# 【課題を解決するための手段】

上記録題を解決するための第1発明の構成は、

散とする。

## 【作用及び効果】

サファイア基板上に、成長温度400~900 でで 膜厚100~500 Aに成長され、結晶構造を無定形 結晶中に散結晶又は多結晶又の混在したウルン イト構造とする窒化アルミニウム(A2N) から成 るパッファ暦を設けたため、そのパッファ圏上に 成長する窒化がリウム系化合物半導体の結晶性が 良くなった。又、本発明の発光素子は、同様な構 成のパッファ層を設けたため、青色発光特性が改 満された。

### 【実施例】

以下、本発明を具体的な実施例に基づいて説明 する。

第1図は本発明を実施するための気相成長装置 の構成を示した斯面図である。

石英曽10はその左端で〇リング15でシールされてフランジ14に当接し、緩衝材38と固定 具39を用い、ポルト46、47とナット48、 49等により数箇所にてフランジ14に固定され 有機金属化合物がスを用いてサファイア基板上に窒化がりウム系化合物半導体障膜(A & \* G a n - N : X=0 を含む)を気相成長させる方法において、サファイア基板上に、成長温度400~900 でで膜厚100~500 人に成長温度400~900 でで膜厚100~500 人に成長高限ではたウルッテイト構造とする変化アルミニウム (A 2 N) から成るパッファ暦を設け、そのパッファ暦上に変化がりウム系化合物半導体(A & \* G a n - \* N : X=0 を含む)を成長させることを特徴とする。

又、第2角明の構成は、サファイイを板はない。 発着としての窒化がリウム系化合物半導体な限 (A & x G a - x N : I=0 を含む)を有する発光 素子において、前記サファイア基板上に成長を発光 度 400~900 でで 膜厚 100~500 人に成長 品 ス に 成 最 品 根 在 し た ウ ル ツァイト 構造 と する 窒 化 ア ル に の ウム (A & N) から成る パッファ 圏上に 窒化が リウム系 化合物 半導体 (A & x G a - x N : X=0 を含む)を成長させることを特

ている。又、石英寶10の右端は〇リング40で シールされてフランジ27に螺子締固定具41. 42により固定されている。

石英管10で囲われた内室11には、反応ガスを導くライナー管12が配設されている。そのライナー管12の一端13はフランジ14に固設された保持プレート17で保持され、その他端16の底部18は保持脚19で石英管10に保持されている。

 さは 7.0cm であり、 2 始方向の長さは 1.2cm である。

ライナー 12の下統例には、サセプタ20を 数置するX 輪に垂直な断面形状が長方形の試料 数置室21か一体的に連設されている。その試料 数置室21の底部22にサセブタ20が数置される。そのサセプタ20はX 輪に動して 4 を であるが、そのサロックを 20の上面 23に試料、即ち、長方形のサファイア 基板 50が 数置されるが、そのサファイア 基板 50が 数置されるが、そのサファイア 基板 50 とそれに面するライナー管12の上部管壁24との間線は、上流側で12mm、下波側で4mmである。

サセプタ 2 0 には提作棒 2 6 が接続されており、フランジ 2 7 を取り外してその操作棒 2 6 により、サファイア 基板 5 0 を戴置したサセプタ 2 0 を試料数置室 2 1 へ設置したり、結晶成長の終わった時に、試料載置室 2 1 からサセプタ 2 0 を取り出せるようになっている。

又、ライナー管12の上流側には、第1ガス管

又、石英智 I 0 の外周部には冷却水を循環させる冷却智 3・3 が形成され、その外周部には高周波電界を印加するための高周波コイル 3 4 が配設されている。

又、 ライナー智 1 2 はフランジ 1 4 を介して外 部 智 3 5 と接続されており、 その外部 智 3 5 から はキャリアガスが導入されるようになっている。

又、試料級匯室21には、側方から導入管36 がフランジ14を通過して外部から伸びており、 その導入管36内に試料の温度を測定する熱電対 43とその導線44,45が配設されており、試 料温度を外部から測定できるように構成されてい る。

このような装置構成により、第1ガス替28で 事かれたNH。とTMGとTMAとH。との混合 ガスと、第2ガス替29で導かれたDE2とH。 との混合ガスがそれらの管の出口付近で混合され、 その混合反応ガスはライナー管12により試料数 置宝21へ導かれ、サファイア基板50とライナ 2 8 が明ロし、第 2 がス 2 9 は熔部で封止されて第 1 がス替 2 8 を覆っている。そして、それらの両替 2 8 . 2 9 は同軸状に 2 重智構造をしている。第 1 がス智 2 8 の第 2 がス管 2 9 から突出した部分と第 2 がス管 2 9 の側周部には、多数の穴3 0 が開けられており、第 1 がス管 2 8 と第 2 がス管 2 9 により導入された反応がスは、それぞれ、多数の穴3 0 を介してライナー管 1 2 の内部で、両反応がスは初めて混合される。

その第1ガス管28は第1マニホールド31に接続され、第2ガス管29は第2マニホールド32に接続されている。そして、第1マニホールド31にはNH。の供給系統Hとキャリアガスの供給系統1とトリメチルガリウム(以下「TMG」と記す)の供給系統とが接続され、第2マニホールド32にはキャリアガスの供給系統「とジェチル亜鉛(以下「DE2」と記す)の供給系統「とジェチル亜鉛(以下「DE2」と記す)の供給系統しとが接続されている。

を通過する。この時、サファイア基板 5 0 上の反 応がスの流れが均一となり、場所依存性の少ない 良質な結晶が成長する。

N型のAla Ca.a N 薄膜を形成する場合に は、第1ガス管28だけから混合ガスを旅出させ れば良く、 I 型の A & x G a 1-x N 傳 膜を形成す る場合には、第1ガス管28と第2ガス管29と からそれぞれの混合ガスを放出させれば良い。! 型のAlaGa,-x N醇膜を形成する場合には、 ドーパントガスであるDEZは第1ガス管28か ら渡出する反応ガスとサファイア基板 500近辺 のライナー聞12の内部で初めて混合されること になる。そして、DE2はサファイア基板50に 吹き付けられ熱分解し、ドーパント元素は成長す るAlx Gaix Nにドーピングされて、I型の Alr Gal-x Nが得られる。この場合、第1が ス智28と第2ガス替29とで分離して、反応が スとドーパントガスがサファイア基板50の付近 まで導かれるので、良好なドーピングが行われる。 次のようにして結晶成長をおこなった。

まず、有級洗浄及び熱処理により洗浄した (000 1) 面を主面とする単結晶のサファイア基板 5 0 をサセブタ 2 0 に装着する。次に、H。を 0.3 & /分で、第 1 ガス智 2 8 及び第 2 ガス智 2 9 及び外部 替 3 5 を介してライナー 管 1 2 に流しながら、温度 1100ででサファイア基板 5 0 を気相エッチングした。次に温度を 650 でまで低下させて、第 1 ガス智 2 8 からH。を 3 & /分、NH。を 2 & /分、 1 5 でのTMAを 5 0 cc/分で 2 分間供給した。

この成長工程で、第6図に示すように、A&N のパッファ層51が約300人の厚さに形成された。 このパッファ層のRHBBD 像を刺定した。その結果 を第7図に示す。第7図のRHBBD 像から、結晶構 造は非単結晶、即ち、アモルファス、微結晶、多 結晶となっていることが理解される。

又、上記装置を用いて他のサファイア基板上に 成長温度 650 セで蕨厚を 50~1000 A 範囲で変化さ せて、各種の A & N のバッファ層を形成した。 そ

厚300 AのAℓNのバッファ層を成長温度を300~1200℃の範囲で変化させて、各種成長させた。そして、同様にAℓNのバッファ層のRHB80 像を例定した。その結果を第12図(a),(b) に示す。このことから、成長温度か300 で以下であるとAℓNバッファ層の所望の膜厚が得られず、成長温度が900 で以上となるとAℓNの結晶化が進んでしまい所望の膜質が得られないことが分る。

の時の表面の RHBBO 像を例定した。その結果を領 8 図(a),(b) に示す。膜厚が100 A 以下だど出は 晶性が強く、膜厚が500 人以上だと多結晶性が強 くなっている。又、AINのパッファ層の原厚が 50~1000A範囲の上記の各種の試料において、試 料温度を 970℃に保持し、第1ガス 管 2 8 からH , を 2.51/分、NH, を 1.51/分、- 1.5 t のTMGを100 cc/分で60分間供給し、第9図に 示すように、腹厚約 7mmのN型のGaNから成る N層52をそれぞれ形成した。そして、このN層 を第10図(a),(b)、第11図(a),(b)に示す。 SEN 像の倍率は4100倍である。 パッファ屋 5 1 の 膜厚が100 人以下だどN唇 5 2 はピットの発生し た状態となり、パッファ暦51の膜厚が500 A以 上においてもN磨 5 2 は100 人以下と同じ状態と なる。従って、結晶性の良いN層を得るには、A ℓNのパッファ層 5 1 の膜厚は100 ~500 人の値 囲が望ましい。

又、他の試料として、サファイア基板上に、段

ら、結晶性の良い N層を得るには、 A  $\ell$  Nのパッファ層の成長温度は  $400\sim900$  七が望ましいことが分る。

満、上記の実験により、ALNのバッファ層の結晶構造は、無定形構造の中に、多結晶又は改結晶が混在したウルツァイト構造であるときに、その上に成長するGaN層の結晶性が良くなることが分かった。そして、その多結晶又は微結晶の存在割合は1~90%が良いことや、その大きさは0.1 畑以下であることが望ましいことが分かった成は、膜厚や成長温度が上記条件の他、反応が入れて、のような結晶構造のALNのバッファ層の形成は、膜厚や成長温度が上記条件の他、反応が入れ、NH、が100cc~102/分、H、が1 L~50ℓ/分の範囲で行ったが、いずれもウルツァイト構造が得られた。

次に本装置を用いて、第15図に示す構成に、 サファイア基板 6 0上に次のようにして結晶成長 をおこなった。

上記と同様にして、単結晶のサファイア 基板 6 0上に、成長温度650 セで、第1ガス管28から H, を3 & /分、N H, を 2 & /分、1 5 でのT M A を 5 0 0 cc/分で 1 分間供給して 350 Å の A ℓNのパッファ層 61を形成した。次に、1分経 過した時にTMAの供給を停止して、 サファイア 基版 6 0 の温度を 970℃に保持し、第 1 ガス 管 2 8からH,を 2.5ℓ/分、NH,を 1.5ℓ/分、 - 1 5 ℃のTMGを 100cc/分で60分間供給し、 腹厚約 7mmのN型のGaNから成るN層 62を形 成した。そのN図62の形成されたサファイア基 版 6 0 を気相成長装置から取り出し、 N 層 6 2 の 主面にホトレジストを塗布して所定パターンのマ スクを使って露光した後ェッチングを行って所定 : パターンのホトレジストを得た。次に、このホト レジストをマスクにして膜厚 100人程度のSi0 ,腹63をパターン形成した。その後、ホトレジ ストを除去しSi0、庾63のみがパターン形成 されたサファイア基板60を洗浄後、再度、サセ

ブタ20に装着し気相エッチングした。そして、 サファイア基板60の温度を 970℃に保持し、第 1 ガス曾2 8 からは、H 』を 2.54 / 分、N H 』 を 1.51/分、-15 CのTMGを 100cc/分供 給し、第2ガス臂29からは、30七のDE2を 500cc/分で5分間供給して、1型のGaNから 成る「層64を膜厚 1.0皿に形成した。この時、 GaNの露出している部分は、単結品のI型のG a N が成長しし輝 6 4 が得られるが、 S i O 。 膜 63の上部には多結晶のGaNから成る導電圏 6 5 が形成される。その後、反応室20からサファ イア基板60を取り出し、「層64と導電層65 の上にアルミニウム電極66、67を落着し、サ ファイア基板60を所定の大きさにカッティング して発光ダイオードを形成した。この場合、領域 86は1度64の気紙となり、電極67は導電層 65と極めて奪いSiO, 腹63を介してN層6 2 の電極となる。そして、 1 層 6 4 を N 層 6 2 に 対し正電位とすることにより、接合面から光が発 光する。

このようにして得られた発光ダイオードは発光 彼長485 nmで、光度10 mcdであった。 A & N パッ ファ唇を単結晶で形成したものに比べて、発光光 度において、 1 0 倍の改善が見られた。

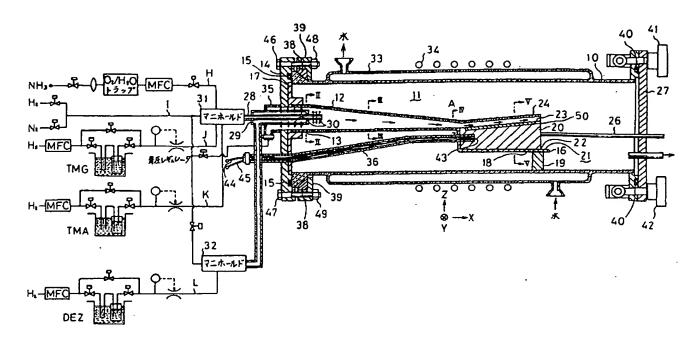
#### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明を実施するのに使用した気相成 最複図の構成図、第2図、第3図、第4図、第5 図はその装図のライナー管の断面図、第6図は結 品成長される半導体の構成を示した断面図に第7 図はAを対のパッファ層のRIFEEOによる方 を示変化させたときのAをNのパッファ層のRHEE Dによる結構さを示した写真、第9図はN型G aN層の短、第11図はAを示した所面図、 第10図、第11図はAを示した所面図、 第20回、第11回図、第10回の原理 を変化させた。 なのパッファ層のRHEE Dによる結構さを示した写真を示した所面図、 第10図、第11回図、第10回に なのパッファ層のRHEE Dによる結構造を示した所面図、 を変化させた。 なのパッファ層のRHEE Dによる結構造を示した写真を示した写真 ないるでは成長による結晶構造を示した写真 12回は成長温度を変化させて成長。 第13図、第14図は成長温度を変化させて成長させた各種のAℓNバッファ暦上に成長させたGaN層の顕微鏡(SEM)による結晶構造を示した写真、及びRHBED による結晶構造を示した写真、第15図は発光ダイオードを作成する場合の結晶構造を示した断面図である。

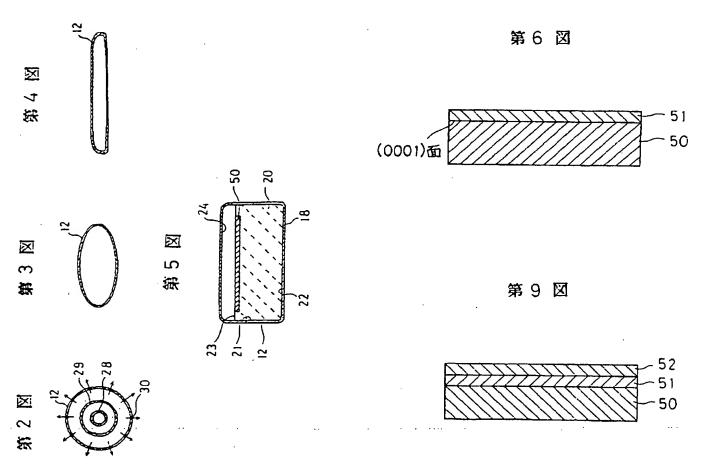
1 0 …石英管 1 2 …ライナー管
2 0 …サセブタ 2 1 …試料設置室
2 8 …第 1 ガス管 2 9 …第 2 ガス管
5 0、6 0 …サファイア基板
5 1、6 1 …A & Nバッファ圏
5 2、6 2 …N層 5 3、6 3 … 1 層
6 4 …事電層 6 5、6 6 … 気極
H …NH。の供給系統
I …キャリアガスの供給系統
J …TMGの供給系統
K …TMAの供給系統

L ···· D E Z の供給系統

# 持閉平2-229476(6)

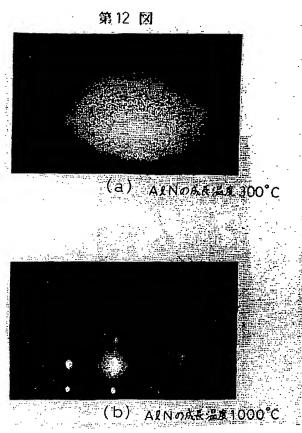


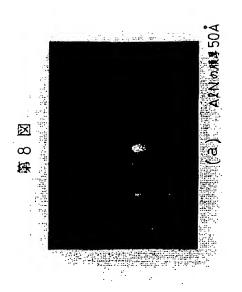
第 1 図

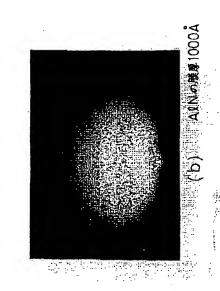


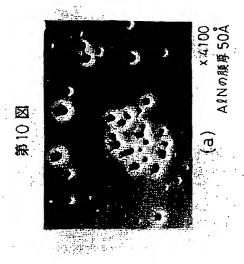
# 特開平2-229476 (7)

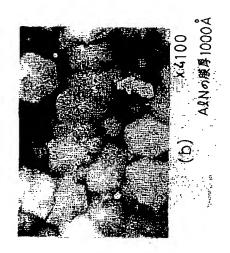
第 7 図

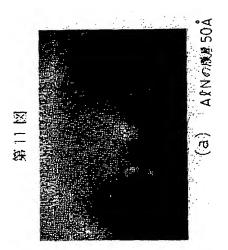


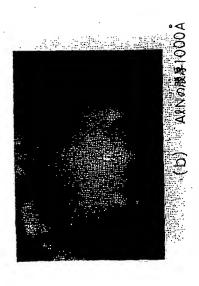




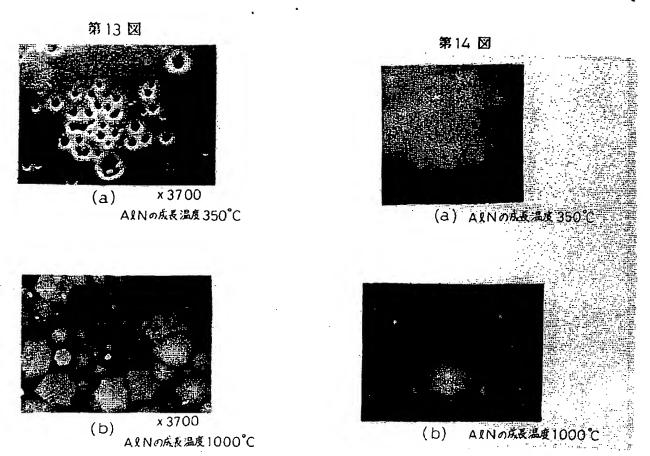




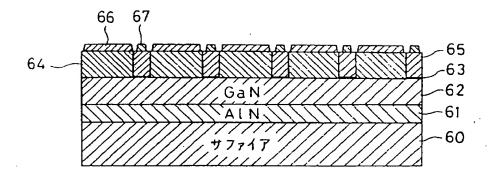




# 特問平2-229476(9)



第15 図



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

05-229476

(43) Date of publication of application: 07.09.1993

(51) Int. CI.

B63B 9/00

(21) Application number: 04-035477

(71) Applicant : JAPAN HAMUWAAJI KK

(22) Date of filing:

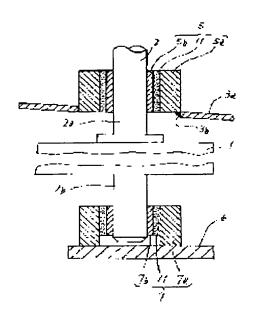
24. 02. 1992

(72) Inventor: TOMITA YUKIO

# (54) INSTALLATION METHOD FOR RUDDER FOR MARINE VESSEL

## (57) Abstract:

PURPOSE: To install a rudder shaft upright without alignment boring by injecting resinous material hardening with time in a place between the outer circumferential surface of each bearing bush and the inner circumferential surface of each bearing boss, and thereby fixing the position of each bearing bush in the radial direction within each bearing boss as the material is hardened. CONSTITUTION: An intermediate bearing 5 has a bearing boss 5a fixed onto the through hole section 3b of a hell 3a, and a lower bearing 7 has a bearing boss 7a fixed onto a shoe piece 6 so as to be provided. Bearing bushes 5b and 7b are loosely engaged with the inside of each bearing boss 5a and 7a respectively with an appropriate gap maintained, the upper and lower rudder shafts 2a and 2b of a rudder shaft 2 are inserted into each bearing bush 5b and 7b so as to be engaged therewith respectively. Moreover, resinous



material 11 hardening with time is injected into a gap between the inner diameter of each bearing boss 5a and 7a and the outer diameter of each bearing bush 5b and 7b. And the positions of the bearing bushes 5b and 7b are fixed in the radial direction with the material 11 hardened. As a result, the axial center of the rudder shaft 2 can be completely aligned with the axial centers of the bearing bushes 5b and 7b without centering both the shaft and each bush.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24. 02. 1992

[Date of sending the examiner's decision 10.01.1995

of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted



registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-229476

(43)公開日 平成5年(1993)9月7日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B 6 3 B 9/00

R 7312-3D

審査請求 有 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-35477

(22)出願日

平成 4年(1992) 2月24日

(71)出願人 000107365

ジャパン・ハムワージ株式会社

大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目15番1号

パーク沢瀉

(72)発明者 冨田 幸雄

大阪府大阪市東成区深江北2丁目4番26号

ジャパン・ハムワージ株式会社内

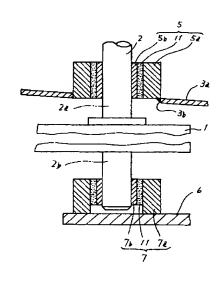
(74)代理人 弁理士 森本 義弘

# (54)【発明の名称】 船舶用舵の取付方法

#### (57) 【要約】

【構成】 軸受ブッシュ5b, 7bにそれぞれ遊嵌する 軸受ボス5a, 7aをその軸心が装着対象の舵軸2の軸 心に沿うように船殻3 a およびシューピース6 にそれぞ れ固設し、軸受ブッシュ5b,7bを装着した舵軸2を 軸受ブッシュ5b,7bがそれぞれ軸受ボス5a,7a 内に位置するように挿入配置し、軸受ブッシュの外周面 と軸受ボスの内周面との間に経時硬化性の樹脂材11を 注入し、硬化した樹脂材11によって軸受ボス5a,7 a内における軸受ブッシュ5b, 7bのそれぞれの半径 方向位置を固定する。

【効果】 軸受ブッシュと軸受ボスとを経時硬化性の樹 脂材で一体化することにより、舵軸を支承する軸受ブッ シュに対して煩雑な芯出しボーリング加工を施さずと も、軸受ブッシュをその軸心が舵軸の軸心と完全に一致 した状態で船体に固定することができる。



6 --- シューピース

7 --- 下部軸受

11 --- 樹脂材

中間軸受

5 a. 7 a --- 軸受ポス

5 b, 7 b --- 軸受ブッシュ

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 軸受ボスをその軸心が装着対象の舵軸の軸心にほぼ一致するように船体固定構造物に固設し、前記軸受ボスに遊嵌する軸受ブッシュを前記舵軸に装着し、前記舵軸を前記軸受ブッシュが前記軸受ボス内に位置するように挿入配置し、前記軸受ブッシュの外周面と軸受ボスの内周面との間に経時硬化性の樹脂材を注入し、硬化した前記樹脂材によって軸受ボス内における軸受ブッシュの半径方向位置を固定することを特徴とする船舶用舵の取付方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、船舶用舵の取付方法に 関する。

[0002]

【従来の技術】従来の船舶において、図6に示すように、舵板1を固定した舵軸2は上端を船体3の内部に配置した舵取機4のスラスト軸受(図示せず)で軸心方向に支承している。また、舵軸2は上部途中を船殻3aの貫通部3bに設けた中間軸受5で支承するとともに、下20端をシューピース6に設けた下部軸受7で支承して水平方向に保持している。さらに、中間軸受5および下部軸受7は船殻3aに固定した軸受ボス5a,7aと軸受ボス5a,7a内に配置した軸受ブッシュ5b,7bとで構成しており、軸受ブッシュ5b,7bに舵軸2を挿嵌させている。

【0003】この舵軸2を中間軸受5および下部軸受7を挿嵌するときには、軸受ブッシュ5b,7bの軸心を一直線上に揃えて舵軸2を真直に保持する必要がある。このために従来は、軸受ボス5a,7a内に軸受ブッシュ5b,7bを配置した後に、軸受ブッシュ5b,7bに対して芯出しボーリング加工を行っていた。

【0004】尚、シューピース6を設けない船舶もあるが、その場合においても、軸受ブッシュ5bに対する芯出しボーリング加工は同様に行う必要があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記した従来の舵の取付構造においては、軸受ブッシュ5b, 7bに対する芯出しボーリング加工の作業が極めて煩雑で、作業工数の増大によって舵軸2の取付作業の能率低下を招 40いて工期が長くなり、取付費用が高くなる問題があった。また、シューピース6を装備する船舶ではシューピース6が舵の装着作業を阻害し、作業能率の低下、工期の長期化、作業コストの高騰を招く問題があった。

【0006】本発明は上記課題を解決するもので、芯出 しボーリング作業を伴うことなく舵軸を真直に取り付け ることができる船舶用舵の取付方法を提供することを目 的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 50 で、軸受ブッシュ5 b, 7 bの外周面と軸受ボス5 a,

に本発明の船舶用舵の取付構造は、軸受ボスをその軸心が装着対象の舵軸の軸心にほぼ一致するように船体固定構造物に固設し、前記軸受ボスに遊嵌する軸受ブッシュを前記舵軸に装着し、前記舵軸を前記軸受ブッシュが前記軸受ボス内に位置するように挿入配置し、前記軸受ブッシュの外周面と軸受ボスの内周面との間に経時硬化性の樹脂材を注入し、硬化した前記樹脂材によって軸受ボス内における軸受ブッシュの半径方向位置を固定する構成としたものである。

10 [0008]

【作用】上記構成により、予め舵軸に装着した状態の軸受ブッシュを樹脂材を介して軸受ボスに固定するので、装着に際し改めて舵軸と軸受ブッシュの芯出しを行う必要がなくなり、舵軸を支承する軸受ブッシュに対して、多くの作業工数とコスト並びに長い工期を要する煩雑な芯出しボーリング加工を施す必要がない。

【0009】また、下部舵軸をシューピースで支承する船舶においては、シューピースを船体に取り付けた状態で芯出しボーリング加工を施す必要がないので、シューピースを取り付けない状態で船体に対する舵の装着作業を行うことができ、舵の装着後に、下部舵軸を支承するシューピースを船体に取り付け、シューピースに設けた軸受ボスと下部舵軸に設けた軸受ブッシュとの間に経時硬化性の樹脂材を注入することにより、シューピースに対する下部舵軸の位置決めを行うことが可能である。

[0 0 1 0]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。図6において説明した部材と同様の作用を行う部材については同一番号を付して説明を省略する。図1において、中間軸受5は船殻3aの貫通部3bに軸受ボス5aを固定して設けてあり、下部軸受7は軸受ボス7aをシューピース6に固定して設けてある。この軸受ボス5aおよび7aの内部には軸受ブッシュ5bおよび7bが多少の軸心ずれを許容できるように適当間隙をあけて遊嵌しており、軸受ブッシュ5b,7bにはそれぞれを軸2の上部舵軸2aおよび下部舵軸2bが挿嵌している。また、軸受ボス5a,7aの内径と軸受ブッシュ5b,7bの外径との差によって生じるそれぞれの間隙には経時硬化性の樹脂材11を注入しており、樹脂材11によって軸受ボス5a,7aと軸受ブッシュ5b,7bがそれぞれ一体化している。

【0011】上記構成における舵の装着手順を説明する。まず、軸受ボス5a,7aを各々の軸心が舵軸2の軸心にほぼ一致するように、貫通部3bおよびシューピース6にそれぞれ固定する。しかる後に、予め軸受ブッシュ5b,7bをそれぞれ装着した上部舵軸2aおよび下部舵軸2bを軸受ボス5a,7aにそれぞれ挿嵌し、軸心方向において軸受ブッシュ5b,7bが軸受ボス5a,7a内にそれぞれ位置するように仮固定した状態で、軸受ブッシュ5b,7bの外間面と軸受ボス5a

. 3

7 aの内周面とのそれぞれの間隙に経時硬化性の樹脂材 11を注入し、硬化した樹脂材11によって軸受ボス5 a,7 a内における軸受ブッシュ5b,7 bのそれぞれ の半径方向位置を固定する。

【0012】尚、予めシューピース6を船体部材から切り離した状態にしておいてから舵を装着する場合の手順として、まず軸受ボス5aを、その軸心が舵軸2の軸心にほぼ一致するように、貫通部3bに固定する。しかる後に、予め上部舵軸2aに軸受ブッシュ5bを装着した舵軸2を、軸受ブッシュ5bが軸心方向において軸受ボ 10ス5a内に位置するように、軸受ボス5aに挿嵌し、その位置で軸受ブッシュ5bを仮固定する。そして、舵軸2を舵取機4に回動自在に固定する。

【0013】次に、予め船体部材から切り離してあるシューピース6に軸受ボス7aを、その軸心が舵軸2の軸心とほぼ一致する位置に固定する。続いて、軸受ブッシュ7bを下部舵軸2bに装着した状態でシューピース6に固定した軸受ボス7aを、軸受ブッシュ7bが軸心方向において軸受ボス7a内に位置するように、軸受ブッシュ7bに下方から挿嵌し、その状態で軸受ブッシュ7bを仮固定するとともに、シューピース6を船体固定部材に溶接固定する。

【0014】上記状態において、軸受ブッシュ5b,7bの外周面と軸受ボス5a,7aの内周面とのそれぞれの間隙に経時硬化性の樹脂材11を注入し、硬化した樹脂材11によって軸受ボス5a,7a内における軸受ブッシュ5b,7bのそれぞれの半径方向位置を固定する。

【0015】したがって、装着に際し改めて舵軸2と軸受ブッシュ5b,7bの芯出しを行なわずとも、軸受ブッシュ5b,7bをその軸心が舵軸2の軸心と完全に一致した状態で船殻3aおよびシューピース6に固定することができ、従来のように舵軸2を支承する軸受ブッシュ5b,7bに対して煩雑な芯出しボーリング加工を施す必要がない。

【0016】図2は本発明の他の実施例を示すものであり、中間軸受5と下部軸受7は基本的に同様の構造であるので、ここでは中間軸受5について説明する。図2において、軸受ブッシュ5りの外周にはスリーブ12を軸心方向に摺動自在に介在させてあり、スリーブ12の外 40周面と軸受ボス5aの内周面との間に生じる間隙に経時硬化性の樹脂材11を注入し、樹脂材11によってスリーブ12と軸受ボス5aを一体的に固定している。

【0017】この構成によれば、仮に軸受ブッシュ5bが損傷もしくは摩耗した場合に、スリーブ12を軸受ボス5aに固定した状態のままに軸受ブッシュ5bを引き抜くことができ、軸受ブッシュ5bを容易に交換することができる。

【0018】また、図3に示すように、軸受ボス5aと 固定した軸受ボスとを経時硬化性の樹脂材で一体化するスリーブ12の間隙の下方開口を塞ぐように、トレイ板 50 ことにより、舵軸を支承する軸受ブッシュに対して、多

13を軸受ボス5aの下面に取り付け、経時硬化性の樹脂材11を注入するときに、流動状態の樹脂材11の滴れを防ぐことにより、樹脂材11の注入作業を容易に行うことができる。

【0019】図 $4\sim$ 図5は本発明のさらに他の実施例を示すものである。図 $4\sim$ 図5において、中間軸受21は軸受ボス21aを船尾船殻22に固定して設けており、軸受ボス21aの内部には舵軸23に挿嵌する軸受ブッシュ21bを設けている。

【0020】そして、舵軸23の下端に舵板24を油圧締付、溶接もしくはキー止めによって固設してあり、舵板24の下端には下部ピントル25を溶接固定している。この下部ピントル25を支承するためのシューピース26には下部軸受27を設けている。この下部軸受27はシューピース26に固設した軸受ボス27aと下部ピントル25に装着した軸受ブッシュ27bとを有し、軸受ボス27aと軸受ブッシュ27bの間に経時硬化性の樹脂材28を注入しており、樹脂材28によって軸受ボス27aと軸受ブッシュ27bを一体的に固定している。また、シューピース26の下面には軸受ボス27aと軸受ブッシュ27bの間に生じる間隙の下面開口を閉塞する環状のトレイ板29を設けている。

【0021】この構成においては、シューピース26を取り付けていない状態の船尾船殻22に中間軸受21を介して舵軸23を取り付ける。このとき、舵軸23に舵板24を既に固定しておいても良いし、後に取り付けても良い。

【0022】そして、予めシューピース26に固設した下部軸受27の軸受ボス27aを下部ピントル25に挿嵌させてシューピース26を船体固定部材に溶接固定する。さらに、下部ピントル25に軸受ブッシュ27bを装着し、軸受ブッシュ27bを仮止めした状態で軸受ボス27aと軸受ブッシュ27bの間に生じる間隙に経時硬化性の樹脂材28を注入し、樹脂材28の硬化によって軸受ボス27aと軸受ブッシュ27bを一体的に固定する。

【0023】したがって、シューピース26を取り付けない状態で船体に対する舵の装着作業を行うことができ、舵の装着作業の容易化を図ることができる。また、舵板24と舵軸23をフランジ形式を用いることなく、溶接等により直接結合することができる。さらに、下部ピントル25も舵板24に直接結合することができ、舵構造の簡略化を図り、工期の短縮とコストの低減を図ることができる。

# [0024]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、予め 舵軸に装着した状態の軸受ブッシュと船体固定構造物に 固定した軸受ボスとを経時硬化性の樹脂材で一体化する ことにより、舵軸を支承する軸受ブッシュに対して、多 5

くの作業工数とコスト並びに長い工期を要する煩雑な芯出しポーリング加工を施さずとも、軸受ブッシュをその軸心が舵軸の軸心と完全に一致した状態で船体に固定することができる。

【0025】また、シューピースを取り付けない状態で 船体に対する舵の装着作業を行うことができ、舵の装着 作業の容易化を図ることができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す船舶用舵の取付構造を 示す断面図である。

【図2】本発明の他の実施例を示す船舶用舵の取付構造を示す断面図である。

【図3】本発明のさらに他の実施例を示す船舶用舵の取付構造を示す断面図である。

【図4】本発明のさらに他の実施例を示す船舶用舵の取

付構造を示す断面図である。

【図5】図4におけるA部の拡大断面図である。

舵軸

【図6】従来の船舶用舵の取付構造を示す断面図である。

# 【符号の説明】

2

	.=	
	3	船体
	3 a	船殼
	5	中間軸受
10	5 a, 7 a	軸受ボス
	5 b, 7 b	軸受ブッシュ
	6	シューピース
	7	下部軸受
	1 1	樹脂材

